

02; 05

© 1991 г.

## ИЗЛУЧЕНИЕ БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ИЗОГНУТОМ КРИСТАЛЛЕ

*В. А. Арутюнов, Н. А. Кудряшов, М. Н. Стриханов, В. М. Самсонов*

Рассмотрено излучение, сопровождающее поворот пучков быстрых заряженных частиц с помощью изогнутого кристалла. Впервые получены выражения для интенсивности излучения, представляющего собой интерференцию синхротронного и ондуляторного излучений в изогнутом кристалле, показано, что при  $R \rightarrow \infty$  (где  $R$  — радиус изгиба кристалла) соответствующие формулы переходят в известные выражения для излучения в прямом кристалле. Рассмотрено дипольное и магнитотормозное излучение в изогнутом кристалле. Выполнены численные расчеты излучения в реалистичном потенциале изогнутых плоскостей для пучков с различными параметрами.

### Введение

При повороте пучков быстрых заряженных частиц (БЗЧ) с помощью изогнутого кристалла (ИК) [1-3] возникает специфическое излучение [4], представляющее собой интерференцию синхротронного излучения [5] (движение по криволинейной траектории, определяемой радиусом изгиба кристалла  $R$ ) и ондуляторного излучения при каналировании [6] (бетатронные колебания каналированных частиц). Эффективные частоты синхротронного  $\omega_s = \gamma^3/R$  и ондуляторного излучений  $\omega_m$  существенно зависят от релятивистского фактора частицы  $\gamma$ , что позволяет применять указанное излучение для идентификации быстрых частиц. С другой стороны, интенсивность синхротронного и ондуляторного излучений в кристалле также существенно зависит от  $\gamma$ . Для легких частиц (электронов и позитронов) излучение в кристалле во много раз превышает обычный «тормозной фон» уже при энергиях  $E \geq 1$  ГэВ [6, 7]. Для детектирования излучения более тяжелых частиц ( $\pi$ -мезонов, протонов и т. д.) необходимо, во-первых, использовать более высокие энергии частиц и, во-вторых, пространственно разделить синхротронно-ондуляторное излучение повернутой фракции пучка частиц в ИК и тормозной фон «прямого пучка». Указанные обстоятельства делают перспективным использование излучения в ИК для идентификации частиц ТэВ-ных энергий в SSC и УНК. Важной также является возможность получения с помощью ИК поляризованных пучков частиц высокой энергии [4].

Отметим кратко основные закономерности излучения БЗЧ в прямом кристалле при движении под малым углом  $\theta_x \ll 1$  к кристаллографической плоскости [6, 7]. Характер излучения существенно зависит от величины параметра  $\rho = 2\gamma^2 \langle v_x^2 \rangle$  [7], где  $v_x(x, E_\perp) = \sqrt{(2/E)(E - V(x))}$  — поперечная скорость частицы;  $E = \gamma M$  — полная энергия;  $M$  — масса (используется система единиц  $\hbar = c = 1$ );  $E_\perp = E\theta_x^2/2$  — поперечная энергия;  $V(x)$  — потенциал плоскостей. Излучение является дипольным в случае  $\rho \ll 1$ , который реализуется при энергиях  $\gamma \ll \gamma_0 = M/V_0$  ( $V_0 = \max V(x)$  — глубина потенциальной ямы). Например, для (111) плоскостей Si имеем  $\gamma_0 \sim 2 \cdot 10^4$  в случае позитронов,  $\gamma_0 \sim 6 \cdot 10^6$  в случае  $\pi$ -мезонов. В дипольном случае излучение частиц при больших углах влета  $\theta_x \gg \theta_L$  (где  $\theta_L = \sqrt{2U_0/\rho v}$  — критический угол каналирова-

ния;  $p, v$  — импульс и скорость частицы) с хорошей точностью описывается теорией когерентного тормозного излучения (КТИ) [8].

При высоких энергиях  $\gamma \gg \gamma_0$  (при  $\rho \gg 1$ ) применим магнитотормозной подход [7], тогда интенсивность излучения выражается через локальные характеристики кристалла. Качественные особенности спектрального распределения излучения при таких энергиях существенно зависят от параметра  $\chi_s = \gamma U_0 / M^2 a_s$  [7] ( $a_s$  — радиус экранирования атомов кристалла) и угла движения частицы к плоскости. При  $\chi_s \ll 1$  и  $\theta_x \ll 1/\gamma_0$  ( $E_1 \ll (\gamma/\gamma_0)U_0$ ) максимум спектральной плотности излучения приходится на малые частоты  $\omega_{\text{эф}} \sim \gamma^3 W \ll E$ , где  $W = (1/E)(-\partial U/\partial x)$  — классическое ускорение в поле плоскостей (осей). Таким образом, в указанном случае излучение в кристалле с хорошей точностью описывается классической теорией. С ростом энергии частицы  $\chi_s$  увеличивается (например, для позитронов с  $E=250$  ГэВ, движущихся в поле плоскостей кремния  $\chi_s \sim 0.25$  [4]) и доля вклада частот  $\omega \sim E$  становится заметной, а при  $\chi_s \gg 1$  — преобладающей [7, 18]. При этом сечение излучения более чем на порядок превосходит сечение излучения в аморфном теле, что фактически означает соответствующее сокращение радиационной длины. При движении под достаточно большими углами к плоскости  $\theta_x \gg \gamma_0^{-1} \gg \theta_L$  ( $E_1 \gg (\gamma/\gamma_0)U_0$ ) излучение с хорошей точностью описывается теорией КТИ.

В изогнутом кристалле удобно пучок частиц разделить на неканалированную (прямой пучок) и каналированную фракции (повернутый пучок) [1-3]. Между этими фракциями существует довольно сложная динамика обмена [9, 10]. Если ограничиться углами изгиба кристалла  $\psi \gg \epsilon_c/M = \gamma_c^{-1}$  ( $\epsilon_c$  — глубина потенциальной ямы изогнутых плоскостей), то неканалированные частицы преобладающую часть времени движутся под большими углами ( $\gg \gamma_c^{-1}$ ) к плоскостям и излучают, как уже отмечалось, «в режиме КТИ». Указанное условие на угол изгиба легко выполнимо, так как даже для легких частиц (позитроны, электроны) в ИК кремния ( $\epsilon_c \sim 10$  эВ) имеем  $\gamma_c^{-1} \sim 2 \cdot 10^{-4}$ .

Каналированные частицы, как отмечалось выше, участвуют в двух движениях. Эффективные спектральные области синхротронного и ондуляторного излучения в ИК достаточно разделены  $\omega_s \ll \omega_m$ , если когерентная длина синхротронного излучения  $l_s \sim R/\gamma$  значительно превосходит продольный период «бегатронных» осцилляций частицы  $\lambda_0$  [4]. В противоположном случае  $l_s \leq \lambda_0$  эффективные спектральные области указанных типов излучения перекрываются и разделить их представляется затруднительным [11].

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует последовательная теория излучения БЗЧ в ИК. В частности, в работе [11] проведено прямое компьютерное моделирование излучения БЗЧ в ИК. Основным недостатком компьютерного моделирования является то, что в качестве основных расчетных формул в [11] были взяты общие формулы классической электродинамики и численное интегрирование проводилось по всей длине кристалла  $L$ , что представляется излишним, так как когерентная длина излучения и продольный период осцилляций обычно много меньше  $L$ . Следует поэтому перед численными расчетами произвести некоторое упрощение исходных формул, а также учесть квантовые аспекты излучения частиц высокой энергии.

В настоящей работе получены выражения для интенсивности излучения БЗЧ в ИК. Показано, что при  $R \rightarrow \infty$  соответствующие формулы переходят в известные выражения для излучения в прямом кристалле [6, 7]. Рассмотрено дипольное и магнитотормозное излучение БЗЧ в ИК. Выполнены численные расчеты излучения в реалистичном потенциале изогнутых плоскостей для пучков с различными параметрами.

### Спектрально-угловое распределение излучения в изогнутом кристалле

Спектрально-угловое распределение энергии, излучаемой ультрарелятивистской заряженной частицей со спином  $1/2$  и в рамках квазиклассического операторного формализма [7] определяется следующей формулой [7, 12]:

$$d\varepsilon = e^2 \frac{d^3k}{(2\pi)^2} \int dt_1 \int dt_2 \frac{1}{2E_1'^2} [(E^2 + E'^2)(\mathbf{v}_2 \mathbf{v}_1 - 1) + \omega^2 \gamma^{-2}] \exp[ik'^\mu (x_1^\mu - x_2^\mu)], \quad (1)$$

где  $k'^{\mu} = k^{\mu} E/E'$ ;  $k^{\mu} = (\omega, \mathbf{k})$  — 4-импульс фотона;  $E' = E - \omega$  — энергия частицы после излучения;  $x_{1,2}^{\mu} = (t_{1,2}, \mathbf{r}_{1,2})$ ;  $r_{1,2}$  — координаты частицы в моменты времени  $t_{1,2}$ ;  $v_{1,2}$  — скорость частицы в соответствующий момент времени.

Рассмотрим движение частицы в ИК с постоянной кривизной ( $R = \text{const}$ ). Удобно использовать цилиндрические координаты  $(r, \varphi, z)$  с соответствующими ортами  $e_r(\varphi)$ ,  $e_{\varphi}(\varphi)$ ,  $e_z$ . Для простоты рассматриваем движение в плоскости, перпендикулярной оси изгиба кристалла  $z=0$ . Рассмотрим также для определенности движение каналированной частицы в канале радиуса  $R_m$

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = [R_m + x(t)] e_r(\varphi(t)), \quad (2)$$

$$v(t) = \dot{\mathbf{r}}(t) \approx R_m \dot{\varphi} e_{\varphi}(\varphi(t)) + v_x e_r(\varphi(t)), \quad (3)$$

где  $v_x = \dot{x}$  — поперечная (радиальная) скорость, мы использовали соотношения  $de_r/d\varphi = e_{\varphi}$ ,  $x \ll R_m$ .

Из (3) получаем выражения для угловой скорости вращения частицы и угла поворота (здесь и ниже опускаем индекс  $R_m \rightarrow R$ )

$$\dot{\varphi} \approx \frac{1}{R} (v - \frac{v_x^2}{2}) \approx \frac{1}{R} \left[ V - \frac{1}{2} (v_x^2 - \langle v_x^2 \rangle) \right],$$

$$\varphi \approx \frac{1}{R} [Vt - \Delta(t)],$$

где мы использовали неравенство  $v_x \ll v$  и ввели следующие обозначения [7]:

$$V = \frac{1}{T} \int_0^T dt \sqrt{v^2 - v_x^2} \approx v - \frac{1}{2} \langle v_x^2 \rangle$$

— средняя продольная скорость,  $\langle v_x^2 \rangle = (1/T) \int_0^T dt v_x^2(t)$  — средний квадрат поперечной скорости;  $\Delta(t) = \Omega_0 \int_0^t d\xi [v_x^2(\xi) - \langle v_x^2 \rangle]$  [7],  $T$  — период колебаний,  $\Omega_0 = 2\pi/T$  — частота колебаний.

Следуя подходу Ландау—Померанчука [12], перейдем в (1) к переменным  $t = (t_1 + t_2)/2$ ;  $\tau = t_2 - t_1$ . Учитывая то, что когерентная длина рассматриваемого излучения ультрарелятивистских частиц много меньше  $R$ , проведем в формулах (2), (3) разложения с необходимой точностью:

$$e_r(\varphi(t \pm \frac{\tau}{2})) \approx e_r \pm \frac{\tau}{2} \frac{V}{R} e_{\varphi} - \frac{\Delta(t \pm \frac{\tau}{2})}{2\Omega_0 R} e_{\varphi} - \frac{\tau^2}{8} \left(\frac{V}{R}\right)^2 e_r \mp \frac{\tau^3}{48} \left(\frac{V}{R}\right)^3 e_{\varphi} + \dots,$$

$$e_{\varphi}(\varphi(t \pm \frac{\tau}{2})) \approx e_{\varphi} \mp \frac{\tau}{2} \frac{V}{R} e_r + \frac{\Delta(t \pm \frac{\tau}{2})}{2\Omega_0 R} e_r - \frac{\tau^2}{8} \left(\frac{V}{R}\right)^2 e_{\varphi} + \dots \quad (4)$$

В правых частях (4)  $e_{\tau, \varphi} \equiv e_{\tau, \varphi}(Vt/R)$ . Используя (4), получим из (1)

$$dE(\mathbf{n}, \omega) = e^2 \frac{d^3 k}{(2\pi)^2} (1+u) \int dt \int d\tau \left\{ -\gamma^{-2} + \left[ 1 + \frac{u^2}{2(1+u)} \right] \times \right.$$

$$\times \left[ -\frac{\tau^2}{2R^2} + v_{x_2} v_{x_1} - \frac{1}{2} (v_{x_2}^2 + v_{x_1}^2) \right] \exp \left\{ (-i\omega') \left[ \tau(1 - \mathbf{nV}) + \frac{\tau^3}{24R^2} \right] \right\} \times$$

$$\times \exp \left\{ (-i\omega') \left[ a_+(\tau) x_2 - \frac{\Delta_2}{2\Omega_0} - a_-(\tau) x_1 + \frac{\Delta_1}{2\Omega_0} \right] \right\}, \quad (5)$$

где  $\mathbf{n} = \mathbf{k}/\omega$  — направление излучения;  $u = \omega/E - \omega$ ;  $v_{x_{1,2}} \equiv v_x(t_{1,2})$ ;  $\mathbf{V} \equiv \mathbf{V}e_{\varphi}$ ;  $a_{\pm} \equiv ne_r \pm (ne_{\varphi})\tau/2R$ ;  $x_{1,2} \equiv x(t_{1,2})$ ;  $\Delta_{1,2} \equiv \Delta(t_{1,2})$ .

Используя периодичность функций  $x(t)$ ,  $v_x(t)$ ,  $\Delta(t)$  и считая продольный период осцилляций частицы в канале  $\lambda_0 \approx vT$  достаточно малым  $\lambda_0 \ll R$ , полу-

чим из (5) с хорошей точностью для интенсивности излучения следующую формулу:

$$dI(\mathbf{n}, \omega) = e^2 \frac{d^3k}{(2\pi)^2} (1+u) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \exp \left\{ (-i\omega') \left[ \tau(1-\mathbf{nV}) - \frac{\Omega_0 m}{\omega'} + \frac{\tau^3}{24R^2} \right] \right\} \times \right. \\ \left. \times \left\{ -\left[ \gamma^{-2} + \frac{\tau^2}{2R^2} \left( 1 + \frac{u^2}{2(1+u)} \right) \right] f_{+m}^{(0)*}(\tau) f_{-m}^{(0)}(\tau) + \left( 1 + \frac{u^2}{2(1+u)} \right) \left[ \overline{f_{+m}^{(1)*}}(\tau) \overline{f_{-m}^{(1)}}(\tau) - \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. - \frac{1}{2} (f_{+m}^{(2)*}(\tau) f_{-m}^{(2)}(\tau) + f_{+m}^{(2)*}(\tau) f_{-m}^{(2)}(\tau)) \right] \right\} \right\}, \quad (6)$$

где

$$f_{\pm m}^{(l)}(\tau) = \Omega_0 \int_0^{\tau} dt [v_x(t)]^l \exp \left\{ i\Omega_0 m - \omega' \alpha_{\pm}(\tau) x(t) + \frac{\omega' \Delta(t)}{2\Omega_0} \right\}. \quad (7)$$

Формула (6) совпадает при  $x(t)=0$ ,  $u \ll 1$  с известным выражением для синхротронного излучения при движении УЗЧ по окружности [7, 12]. С другой стороны, при  $R \rightarrow \infty$  формула (6) совпадает с соответствующей формулой для излучения в прямом кристалле [7]. В отличие от прямого кристалла [6, 7], где в силу законов сохранения продольного к плоскости импульса и энергии суммирование производится лишь по  $m \geq 1$ , в ИК суммирование в формуле (6) осуществляется по  $m \leq 0$ .

Заметим в заключение, что, проделав аналогичные выкладки, нетрудно убедиться, что при условии  $\lambda_0 \ll R$  ( $\lambda_0$  — продольный период движения) формула (6) справедлива и для неканалированных частиц.

### Дипольное и магнитотормозное излучение в изогнутом кристалле

Рассмотрим сначала дипольный случай  $\rho \ll 1$ , реализующийся при энергиях  $\gamma \ll \gamma_c^{-1}$ . Производя соответствующие разложения в экспонентах (7) и подставляя в (6), получим

$$dI(\mathbf{n}, \omega) = dI_s + \sum_{m \neq 0} dI_m. \quad (8)$$

Здесь

$$dI_s(\mathbf{n}, \omega) = e^2 \frac{d^3k}{(2\pi)^2} 4 \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{(1-\mathbf{nV})^{1/2}}{W_s} [4(1-\mathbf{nV}) - \gamma^{-2}] \times \\ \times K_{1/2} \left( \frac{4\sqrt{2}}{3} (1-\mathbf{nV})^{3/2} \frac{\omega}{W_s} \right) \quad (9)$$

— интенсивность синхротронного излучения [7, 5],  $W_s = 1/R$  — центростремительное ускорение,  $K_\nu(z)$  — функция Макдональда,  $dI_m$  — интенсивность  $m$ -й гармоники ондуляторного излучения

$$dI_m(n, \omega) = e^2 \frac{d^3k}{\pi} \omega \gamma^{-4} \frac{|W_m|^2}{(\Omega_0 \cdot m)^4} x_s^{-1/2} \left\{ Ai'(z_m) + Ai(z_m) \times \right. \\ \left. \times \left[ 4z_m^2 + z_m x_s^{-2/2} (2\gamma^2 (ne_s)^2 - 1) + x_s^{-1/2} \left( \frac{x_m^2}{4} - \gamma^2 (ne_s)^2 \right) \right] \right\}, \quad (10)$$

где

$$W_m = \frac{1}{T} \int_0^T dt \exp(i\Omega_0 \cdot m \cdot t) \left( -\frac{1}{E} \frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial x} \right) = \frac{w_m}{\gamma \gamma_c}, \\ w_m = \frac{1}{x(y)} \int_{s_1}^{s_2} \frac{ds}{\sqrt{y - u_{\text{eff}}(s)}} \left( -\frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial s} \right) \exp \left[ i \frac{2\pi m}{x(y)} \int_{s_1}^s \frac{dv}{\sqrt{y - u_{\text{eff}}(v)}} \right]$$

Заметим, что в дипольном случае эффективные частицы излучения  $\omega_{\text{eff}} \ll E$  и результаты (6) при  $u \ll 1$  и (8)–(10) могут быть получены с помощью классической электродинамики, что расширяет их применимость и на частицы со спином, не равным 1/2.

— Фурье-компонента ускорения частицы,  $u_{\text{eff}} = U_{\text{eff}}/\varepsilon_c = [U(x) - pvx/R]/\varepsilon_c$ ,  $s = x/d$ ,  $d$  — межплоскостное расстояние,  $s_{1,2}$  — точки поворота,  $y = E_{\perp}/\varepsilon_c$ ,  $x(y) = \int_{s_1}^{s_2} ds/\sqrt{y - u_{\text{eff}}(s)}$  — «безразмерный» полупериод колебаний (для неканалированных частиц  $x(y) = \int_0^1 ds/\sqrt{y - u_{\text{eff}}(s)}$  — период движения).

В формуле (3.3)  $Ai(z)$ ,  $Ai'(z)$  — функция Эйри и ее производная;  $z_m = x_s^{2/3} [2\gamma^2(1 - nV) - x_m^{-1}]$ ;  $x_s = \omega/\omega_s$ ;  $x_m = \omega/\omega_m$ ;  $\omega_s = \gamma^3/R$  — характерная частота синхротронного излучения;  $\omega_m = 2\gamma^2 m \Omega_0 = m \cdot \omega_0$  — характерная частота излучения  $m$ -й гармоники ондуляторного излучения;  $\omega_0 = 2^{1/2} \pi \gamma^{3/2} / [2\gamma_c^{1/2} x(y) d]$  (для неканалированных частиц  $\omega_m = 2m\omega_0$ ).

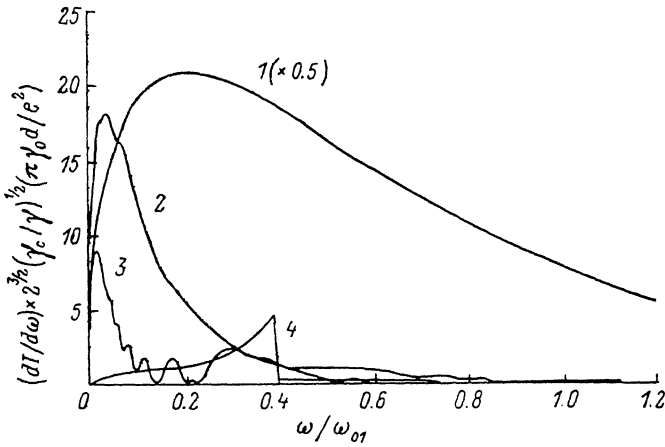


Рис. 1. Спектральное распределение дипольного излучения (формула (11)) в поле (111) плоскостей ИК кремния.

$$\omega_{01} = 2^{1/2} \pi \gamma^{3/2} / \gamma_c^{1/2} \quad d, \quad \gamma/\gamma_c = 0.1, \quad E_{\perp}/\varepsilon_c = 0.5; \quad R/R_c = 2 \text{ (1)}, \quad 5 \text{ (2)}, \quad 10 \text{ (3)}, \quad 4 \cdot 10^3 \text{ (4)}.$$

Интегрируя (8)–(10) по углам излучения, получим спектральное распределение излучения

$$\frac{dI}{d\omega} = \frac{e^2}{\pi d \gamma_0} \left\{ \frac{B}{\sqrt{3}} \frac{R_c}{R} x_s \int_{\frac{2}{3} x_s}^{\infty} K_{3/2}(\xi) d\xi + 2^{-3/2} \left(\frac{\gamma}{\gamma_c}\right)^{1/2} \frac{\varepsilon_c}{U_{11}} \sum_{m \neq 0} x(y) x_0 \frac{|w_m|^2}{m^2} \times \right. \\ \left. \times \left[ \left(1 - 2 \frac{x_0}{m} + 2 \frac{x_0^2}{m^2}\right) Ai_1(\xi_m) + 4 x_s^{-2/3} \frac{x_0}{m} \left(1 - \frac{x_0}{m}\right) Ai'(\xi_m) + 16 x_s^{-1/3} \frac{x_0^2}{m^2} Ai(\xi_m) \right] \right\}, \quad (11)$$

где  $\gamma_0 = M/U_0$ ,  $B = |\nabla U_{\text{max}}| d/U_0$ ,  $\nabla U_{\text{max}}$  — максимальный градиент межплоскостного потенциала в прямом кристалле,  $R_c = \gamma M / |\nabla U_{\text{max}}|$  — критический радиус

Цыганова [1, 13],  $x_0 = \omega/\omega_0$ ,  $\zeta_m = x_s^{2/3} (1 - m/x_0)$ ,  $Ai_1(z) = \int_x^{\infty} Ai(\xi) d\xi$ .

Первое слагаемое в фигурных скобках (11) описывает «чистое» синхротронное излучение, в то время как второе слагаемое отвечает ондуляторному излучению.

На рис. 1, 2 приведены результаты численных расчетов спектрального распределения излучения положительно заряженных частиц по формуле (11) в поле изогнутых (111) плоскостей Si ( $B \approx 0.72$ ) в случае  $\gamma = \gamma_c = 0.1$ ;  $E_{\perp} = \varepsilon_c/2$  для различных радиусов изгиба кристалла  $R/R_c = 2$  (рис. 1, кривая 1);  $R/R_c = 5$  (кривая 2);  $R/R_c = 10$  (кривая 3),  $R/R_c = 20$  (рис. 2, кривая 1);  $R/R_c = 4 \cdot 10^3$  (рис. 1, кривая 4; рис. 2, кривая 2). Межплоскостной потенциал вычислялся «методом Фурье-синтеза» компонент по обратным векторам решетки [14], атомные форм-факторы были взяты из [17]. Спектр излучения в сильноизогнутом кристалле

(рис. 1, кривая 1) с хорошей точностью совпадает со спектром синхротронного излучения (ондуляторная часть излучения мала). При увеличении радиуса изгиба синхротронная часть излучения уменьшается, а ондуляторная часть становится более заметной (кривая 2), при дальнейшем росте  $R/R_c$  синхротронная и ондуляторная части излучения становятся сравнимыми по амплитуде, заметны характерные осцилляции в спектре (кривая 3). При больших значениях  $R/R_c$  преобладает ондуляторная часть излучения, период осцилляций уменьшается (рис. 2, кривая 1), в пределе  $R/R_c \rightarrow \infty$  спектр излучения переходит в известный спектр дипольного излучения в прямом кристалле (рис. 1, кривая 4; рис. 2, кривая 2).

Для отношения характерных частот синхротронного и ондуляторного излучения в ИК имеем следующую оценку:

$$\frac{\omega_s}{\omega_0} = \frac{2^{3/2}\pi}{\kappa(y)} B \cdot \frac{R}{R_c} \cdot \left(\frac{\gamma_c}{\gamma}\right)^{1/2} \frac{U_0}{\epsilon_c}. \quad (12)$$

Отсюда для рассматривавшегося ИК кремния имеем обычно  $\omega_0 > \omega_s$ , т. е. эффективные спектральные области синхротронного и ондуляторного излучений несколько «разнесены».

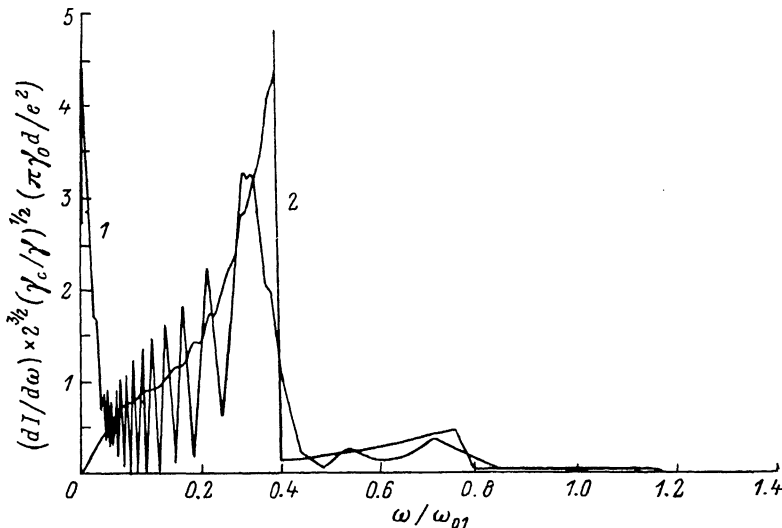


Рис. 2. То же, что на рис. 1.

$R/R_c = 20$  (1),  $4 \cdot 10^3$  (2).

Приведем асимптотические выражения для спектра ондуляторного излучения при условии  $\omega_s \ll \omega_0$ . В этом случае в формуле (11) можно считать  $|\xi_m| \gg 1$ . Поведение  $m$ -й гармоники ( $m > 0$ ) ондуляторного излучения  $dI_m/d\omega$  существенно зависит от соотношения между  $\omega$  и  $\omega_m = m\omega_0$ . При  $\omega < \omega_m$  ( $m/\kappa_0 > 1$ ,  $\xi_m < 0$ ), подставляя асимптотические разложения функций  $Ai_1(\xi_m)$ ,  $Ai(\xi_m)$ ,  $Ai'(\xi_m)$  [16] в формулу (11), получим

$$\frac{dI_{m>0}}{d\omega} \approx \frac{e^2}{\pi d} \frac{\gamma^{1/2}}{(2\gamma_0)^{3/2}} \kappa(y) \kappa_m^{3/2} \frac{|w_m|^2}{m^2} \left\{ (1 - 2\kappa_m + 2\kappa_m^2) - \left(\frac{\omega_s}{\pi m \omega_0}\right)^{1/2} \frac{[5(1 - \kappa_m)^2 + \kappa_m^2]}{(1 - \kappa_m)^{3/4}} \cos \left[ \frac{2}{3} \left(\frac{m\omega_0}{\omega_s}\right) \frac{(1 - \kappa_m)^{3/2}}{\kappa_m^{1/2}} + \frac{\pi}{4} \right] \right\}, \quad (13)$$

где первое слагаемое в фигурных скобках соответствует  $m$ -й гармонике дипольного излучения в прямом кристалле ( $R/R_c \rightarrow \infty$ ) [6], а второе слагаемое является осциллирующей добавкой.

При  $\omega > \omega_m$  ( $m/\kappa_0 < 1$ ,  $\xi_m > 0$ ) спектр  $m$ -й гармоники экспоненциально затухает

$$\frac{dI_m}{d\omega} \approx \frac{e^2}{2^{3/2}d} \frac{\gamma^{1/2} \kappa(y) \kappa_m^{3/2}}{(\pi\gamma_c)^{3/2} m^2} \frac{[5(\kappa_m - 1)^2 + \kappa_m^2]}{(\kappa_m - 1)^{3/4}} \exp \left[ -\frac{2}{3} \left(\frac{m\omega_0}{\omega_s}\right) \frac{(\kappa_m - 1)^{3/2}}{\kappa_m^{1/2}} \right], \quad (14)$$

т. е. при  $R/R_c \rightarrow \infty$  спектр излучений  $m$ -й гармоники дипольного излучения «обрывается» при  $\omega = \omega_m$  [6]. Спектр излучения «отрицательных гармоник» ( $m < 0$ ) при  $\omega_s \ll |m| \omega_0$  дается формулой (14), т. е. экспоненциально затухает во всей области частот.

Для вычисления полной интенсивности излучения проще всего поступить следующим образом. Из классической теории излучения [5-7] следует, что локальная интенсивность излучения (проинтегрированная по частотам) в поле  $U(x)$  равна  $I(x) = 2e^2 \gamma^2 [\nabla U(x)]^2 / 3M^2$ . Усредняя по периоду колебаний, получим полную интенсивность излучения каналированной частицы с поперечной энергией  $E_{\perp} = y \varepsilon_c$

$$I(E_{\perp}) = \frac{1}{x(y)} \int_{s_1}^{s_2} \frac{ds}{\sqrt{y - u_{\text{eff}}(s)}} \frac{2}{3} \frac{e^2 \gamma^2 \varepsilon_c^2}{d^2 M^2} \left( \frac{\partial u_1}{\partial s} \right)^2 = I_s + I_u, \quad (15)$$

где  $I_s = (2/3)(e^2 \gamma^4 / R^2)$  — полная интенсивность синхротронного излучения,  $u_1(s) \equiv U(x) / U_0$ ,

$$I_u = \frac{2}{3} \frac{e^2 \varepsilon_c^2}{M^2 d^2} \frac{1}{x(y)} \int_{s_1}^{s_2} \frac{ds}{\sqrt{y - u_{\text{eff}}(s)}} \left( \frac{\partial u_{\text{off}}}{\partial s} \right)^2 \quad (16)$$

— интенсивность ондуляторного излучения в эффективном потенциале ИК.

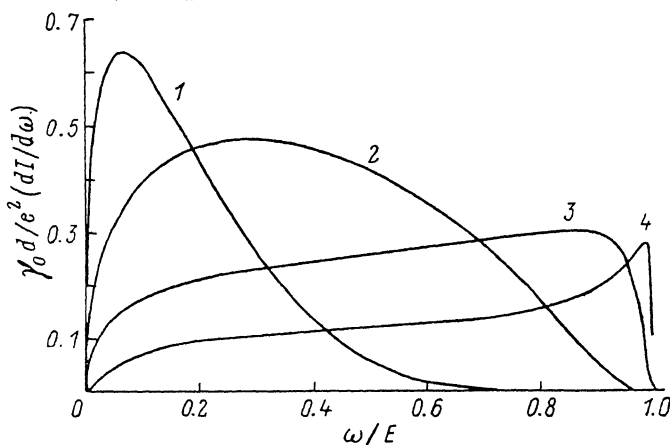


Рис. 3. Спектральное распределение магнитотормозного излучения (формула (17)) в поле (111) плоскостей ИК кремния.

$$R/R_c = 10, E_{\perp}/\varepsilon_c = 0.5.$$

Разумеется, результат (15), (16) может быть получен из формулы (10) интегрированием по частотам. Таким образом, имеем по порядку величины  $I_s/I_u \sim B^2 (R_c/R)^2 (U_0/\varepsilon_c)^2$ .

Рассмотрим теперь противоположный недипольный случай  $\rho \gg 1$ , реализующийся в основном ( $E_{\perp} \geq \varepsilon_c$ ) при энергиях  $\gamma \gg \gamma_c$ . При этом фаза в интегралах (7) велика и можно использовать методы асимптотического интегрирования. Основной вклад в излучение дают при этом гармоники с большими  $m_{\text{eff}} \sim \rho^{3/2} \gg 1$ , излучение носит магнитотормозной характер и определяется локальными характеристиками кристалла (напряженностью поля) [7]. Проще, однако, исходить из общей формулы (1), с помощью которой после необходимых разложений получаем для усредненной по периоду движения интенсивности излучения следующую формулу [7]:

$$dI = \frac{e^2 M^2}{\pi \sqrt{3}} \frac{u du}{(1+u)^3} \frac{1}{x(y)} \int_{s_1}^{s_2} \frac{ds}{\sqrt{y - u_{\text{eff}}(s)}} \left[ \int_{\frac{2}{3} \frac{u}{\chi}}^{\infty} K_{3/2}(\xi) d\xi + \frac{u^2}{(1+u)} K_{3/2} \left( \frac{2}{3} \frac{u}{\chi} \right) \right], \quad (17)$$

где  $\chi = \gamma |\partial U / \partial x| / M^2 = \chi_0 |\partial u_1 / \partial s|$ ;  $\chi_0 = \gamma U_0 / M^2 d$ .

На рис. 3 представлены результаты численных расчетов спектральных распределений излучения ультрарелятивистских позитронов в поле изогнутых к (111) плоскостей Si при  $R/R_c=10$ ;  $E_\perp=\epsilon_c/2$  для различных значений параметра  $\chi_0$ :  $\chi_0=0.06$  (чему соответствует значение  $\gamma=10^6$ ) (кривая 1),  $\chi_0=0.6$  (кривая 2), 6 (кривая 3), 60 (кривая 4). Видно, как уже отмечалось, что при малых  $\chi_0$  максимум спектра приходится на малые частоты  $\omega_{\text{eff}} \ll E$ , при росте  $\chi_0$  эффективные значения  $\omega_{\text{eff}} \sim E$ , а при больших  $\chi_0 \gg 1$  имеется характерный максимум на конце спектра (см., например, [18]).

Заметим, что интенсивность излучения частиц повернутой части пучка (11), (17) существенно зависит от поперечной энергии частиц. Многократное рассеяние заряженных частиц в кристалле, как известно, приводит к эволюции с глубиной функции распределения по поперечным энергиям [9-10]. Ограничиваясь случаем не очень высоких энергий  $\chi \ll 1$ , когда потери энергии реализуются «малыми порциями», можно получить для функции распределения каналированных частиц  $\varphi(t, E_\perp, \Delta)$  кинетическое уравнение, аналогичное уравнению, описывающему ионизационные потери в кристалле [19],

$$\frac{\partial \varphi(t, E_\perp, \Delta)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial E_\perp} \left[ TD \frac{\partial}{\partial E_\perp} \left( \frac{\varphi}{T} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial E_\perp} (A\varphi) + \int d\omega w(E_\perp, \omega) [\varphi|_{\Delta-\omega} - \varphi|_\Delta], \quad (18)$$

где  $\Delta=E-E'$  — потери энергии;

$$D = \frac{p^2 v}{4} \left\langle v_x^2 \frac{\Delta \theta^2(x)}{\Delta s} \right\rangle$$

— коэффициент диффузии в пространстве поперечной энергии вследствие МР;  $\Delta \theta^2(x)/\Delta s$  — средний квадрат угла МР, равный сумме вкладов от рассеяния на колеблющихся ядрах и электронах кристалла;  $A=(2/pv) \langle I(x) \times [E_\perp - U_{\text{eff}}(x)] \rangle$  — коэффициент, описывающий дрейф  $E_\perp \rightarrow 0$ ;  $\langle \dots \rangle = (1/T) \int dx/v_x(\dots)$  означает усреднение по периоду осцилляций;  $w(E_\perp, \omega) = (1/\omega)(dI/d\omega)$  — соответствующая вероятность излучения.

Аналогичное уравнение можно получить для функции распределения неканалированных частиц [9, 19].

### Список литературы

- [1] Водопьянов А. С., Головатюк В. М., Елишев А. Ф. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1979. Т. 30. Вып. 8. С. 474—477.
- [2] Андреев В. А., Баублис В. В., Дамаскинский Е. А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1982. Т. 36. Вып. 9. С. 340—343.
- [3] Сумбаев О. И. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 11. С. 2067—2077.
- [4] Vashnikov Yu. A. // Rad. Eff. 1981. Vol. 56. P. 55—58.
- [5] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1973.
- [6] Kitakhov M. A. // Phys. Lett. 1976. Vol. A57. P. 17—19.
- [7] Байер В. Н., Катков В. М., Страховенко В. М. Электромагнитные процессы при высоких энергиях в ориентированных монокристаллах. Новосибирск: Наука, 1989.
- [8] Тер-Микаелян М. Л. Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких энергиях. Ереван, 1969.
- [9] Кудряшов Н. А., Петровский С. В., Стриганов М. Н. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 4. С. 68—73.
- [10] Белошицкий В. В., Старостин В. А. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. Вып. 8. С. 722—726.
- [11] Taratin A. M., Vorobiev S. A. // Nucl. Instr. Meth. 1988. Vol. B31. P. 551—554. 1989. Vol. B42. P. 41—44.
- [12] Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Пятаевский Л. П. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1980.
- [13] Каплин В. В., Воробьев С. А. // Письма в ЖТФ. 1978. Т. 4. Вып. 4. С. 196—199.
- [14] Каган Ю., Кононец Ю. В. // ЖЭТФ. 1970. Т. 58. Вып. 1. С. 226—244.
- [15] Ахизер А. И., Шульга Н. Ф. // УФН. 1982. Т. 137. № 5. С. 561—602.
- [16] Рыжик И. М., Градштейн И. С. Таблицы сумм, интегралов и рядов. М.: Наука, 1974.
- [17] Doyle P. A., Turner P. S. // Acta Crystallogr. 1968. Vol. A34. P. 394—397.
- [18] Weissert A., Bologna G., Chevallier M. et al. // Phys. Lett. 1988. Vol. B 206. P. 561—566.
- [19] Арутюнов В. А., Кудряшов Н. А., Стриганов М. Н. // Ядерная физика. 1989. Т. 50. № 8. С. 330—334.

Московский инженерно-физический институт

Поступило в Редакцию  
12 октября 1989 г.  
В окончательной редакции  
20 марта 1990 г.